



APORTACIÓN DEL XPER CT EN EL MUESTREO DE VENAS SUPRARRENALES EN PACIENTES CON HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO

L. Díaz Dorronsoro, M.A. Pardina Solano y D.M. González Campos

Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Resumen

Objetivos: El muestreo de venas suprarrenales es la prueba de oro para el diagnóstico y lateralización del aldosteronismo primario. Técnicamente, la cateterización de la vena suprarrenal derecha es compleja debido a su fino calibre y drenaje directo a la vena cava inferior. Describimos nuestra experiencia con el uso del Xper CT para la comprobación de la correcta cateterización de la vena suprarrenal derecha.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 12 pacientes que fueron sometidos a toma de muestras de venas suprarrenales durante los últimos 18 meses en nuestra institución. En 8 de ellos se utilizó el Xper CT para confirmar la correcta posición del catéter durante la toma de muestras de vena suprarrenal derecha. Muestras venosas con un índice > 2 de cortisol vena suprarrenal/cortisol periférico fueron consideradas como representativas.

Resultados: El éxito técnico global del muestreo de suprarrenal derecha fue del 83%. En los 8 pacientes en los que se utilizó el Xper CT el éxito técnico fue del 100%. Hubo dos pacientes en los que el Xper CT identificó la inadecuada cateterización de la vena suprarrenal derecha por lo que se rectificó la posición. Los tiempos medios de escopia fueron menores en el grupo Xper CT.

Conclusiones: El Xper CT es una herramienta que permite comprobar la correcta cateterización de la vena suprarrenal derecha, acortando el tiempo de exploración y aumentando el nivel de confianza del operador.